

## 超高分解能走査型電子顕微鏡



超高分解能走査型電子顕微鏡

日本電子（株）

JSM-7900F

平成29年度導入

（公財）JKA 補助事業



### 【主な用途・仕様】

製品・部品・材料の観察、元素分析を行う装置です。

- ・ 電子銃：電界放出形電子銃
- ・ 加速電圧：0.01～30kV
- ・ 写真倍率：25～100 万倍
- ・ 分解能：1.0nm 以下（二次電子像 1kV、15kV）
- ・ 最大試料サイズ：φ100mm×高さ 40mm
- ・ 分析可能元素：ホウ素（<sub>5</sub>B）からウラン（<sub>92</sub>U）
- ・ 分析機能：定性分析、簡易定量分析、デジタルマッピング
- ・ 観察補助機能：自動焦点合わせ、自動非点収差補正
- ・ データ形式：画像（BMP、TIFF、JPEG） 分析（CSV 等）

\* 絶縁物試料は金属薄膜コーティングが必要です。

\* 真空中で観察するため、液体や揮発成分を多く含む試料にはお使いいただけません。

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

### 【設備使用の項目・使用料】

電界放出形走査電子顕微鏡

電界放出形走査電子顕微鏡写真

### 【受託試験の項目・手数料】

EDS 定性分析(固体、粉末) (電界放出形走査電子顕微鏡を用いたもの)